

Спосіб інтегральної оцінки структурної досконалості кристалів, що включає реєстрацію рентгенівської двокристалльної дифрактограми, який **відрізняється** тим, що від поверхні досліджуваного кристала записують криву коливання в геометрії Бреґа, реєструють максимальне значення її інтенсивності  $R_m$  та її ширину поблизу підніжжя на рівні  $0,2R_m$ , встановлюють співвідношення між ними, а ступінь досконалості кристалів визначають за значенням  $\frac{d}{R_m}$ , де  $d$  - ширина кривої коливань на рівні  $0,2R_m$ , при цьому за умови  $\frac{d}{R_m} \approx 10$  кристали оцінюють як структурно досконали, при значеннях співвідношення у межах  $10 < \frac{d}{R_m} < 20$  - як слабо порушені, а за умови  $\frac{d}{R_m} > 20$  - тим більш порушеними, чим більше  $\frac{d}{R_m}$ .